

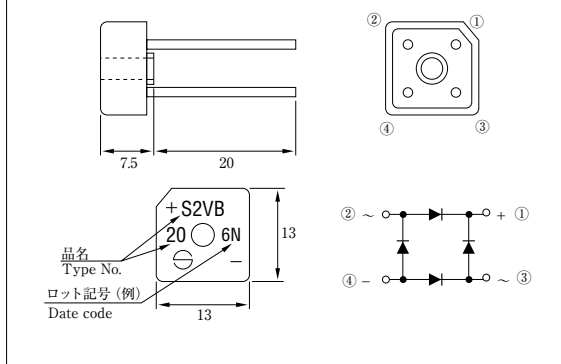
**S2VB**
**600V 2A**
**特長**

- 耐湿性に優れ高信頼性
- 高耐熱性
- 低  $I_R$

**Feature**

- High-Reliability
- Heat Resistance
- Low  $I_R$

**■外観図 OUTLINE**
**Package : S2VB**

 Unit : mm  
 Weight : 3g (typ.)


外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。  
 For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

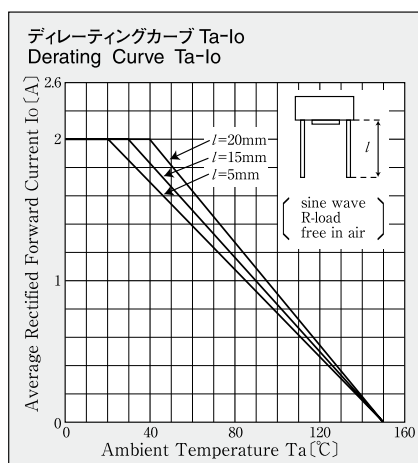
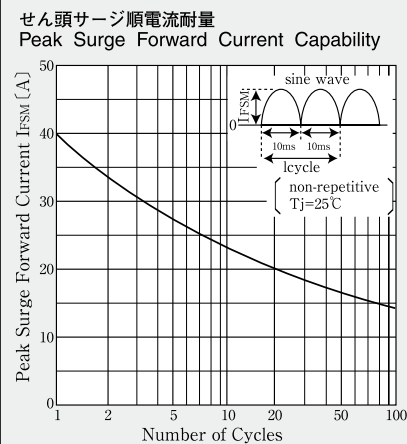
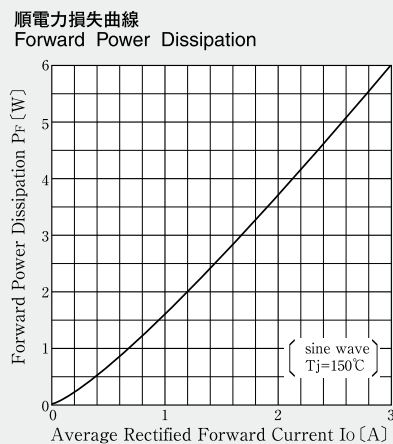
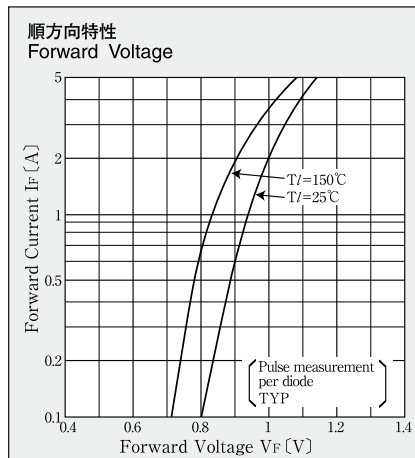
**■定格表 RATINGS**
**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings** (指定のない場合  $T_l = 25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S2VB20	S2VB60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$			- 40 ~ 150		$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	$T_j$			150		$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	$V_{RM}$			200	600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	$I_O$	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, フィンなし, $T_a = 40^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, Without heatsink, $T_a = 40^\circ\text{C}$		2		A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	$I_{FSM}$	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value $T_j = 25^\circ\text{C}$		40		A
電流二乗時間積 Current Squared Time	$I^2t$	$1\text{ms} \leq t < 10\text{ms}$ , $T_j = 25^\circ\text{C}$ , 1 素子当たりの規格値 per diode		6		$\text{A}^2\text{s}$
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.3 N·m) (Recommended torque : 0.3 N·m)		0.5		N·m

**●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics** (指定のない場合  $T_l = 25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	$V_F$	$I_F = 1\text{A}$ , パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	$I_R$	$V_R = V_{RM}$ , パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	$\mu\text{A}$
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{jl}$	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 7	$^\circ\text{C/W}$

# 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- \* Sine wave は 50Hz で測定しています。
- \* 50Hz sine wave is used for measurements.
- \* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。  
Typical は統計的な実力を表しています。
- \* Semiconductor products generally have characteristic variation.  
Typical is a statistical average of the device's ability.